



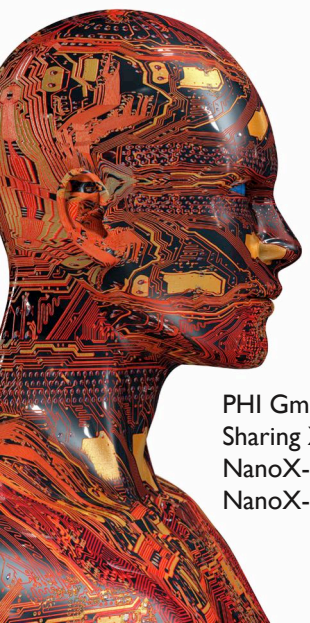
PHYSICAL ELECTRONICS GMBH

NanoX-Pert Advanced Materials

Im Fokus:  
Kolloid und Grenzflächenforschung

Interdisziplinäre Technologien für die komplexen  
und zukunftsweisenden Forschungs- und  
Entwicklungsfelder der Materialwissenschaften  
und Werkstoffkunde

Leitung: Stefan Reichlmaier  
Termin: 18.04.2018  
Ort: Ismaning, Fraunhoferstr. 4  
Physical Electronics GmbH



PHI GmbH's INHOUSE Seminare 2018/2019:  
Sharing X-Perience mit NanoX-Pert  
NanoX-Pert LifeScience (17. Oktober 2018)  
NanoX-Pert AdvancedMaterials (April 2019)

### Registrierung:

bis 29.03.2018

- Ich melde mich für das Seminar an  
 Ich kann leider nicht teilnehmen, bitte  
senden Sie mir Informationen über  
alternative Termine zu.

\_\_\_\_\_  
Name

\_\_\_\_\_  
Firma/Institut

\_\_\_\_\_  
Abteilung/Position

\_\_\_\_\_  
Straße/Postfach

\_\_\_\_\_  
Land/PLZ/Ort

\_\_\_\_\_  
Tel./Fax

\_\_\_\_\_  
E-Mail

Die Datenschutzerklärung ([www.phi-gmbh.eu/imprint](http://www.phi-gmbh.eu/imprint))  
habe ich zur Kenntnis genommen:

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum Unterschrift

### Die Agenda des Tages:

- 09:00 Registrierung  
09:15 Begrüßung und Einleitung  
09:30 **Anwendungsbeispiele:  
Warum High End Analysis?**  
10:15 Vorstellung der Methode ToF-SIMS  
Vorstellung der Methode XPS  
Vorstellung der Methode Auger  
11:15 Kaffeepause  
11:40 **Dr. Miriam Unger (Anasys Instruments)  
Vorstellung AFM-IR +IR Microscope  
mit 0,5µm Ortsauflösung**  
12:15 Mittagessen (Buffet)  
13:00 **Praktischer Teil (4 Gruppen á 20 min)  
ToF-SIMS; XPS; Auger & AFM-IR**  
14:30 **Herr Weingärtner (KIT Karlsruhe)  
Anwendungsbeispiele mit  
Auger Spektroskopie**  
15:00 **Neueste innovative Technologien &  
Entwicklungen im Bereich  
Oberflächenanalytik**  
15:30 Zusammenfassung:  
Testmessungsgutschein & Feedback  
15:45 Kaffeepause  
16:00 Möglichkeit zur Diskussion Ihrer  
individuellen Fragestellung  
16:30 Ende des Seminars

## Zielsetzung:

Dieses Seminar vermittelt Ihnen durch eine interdisziplinäre Herangehensweise einen Überblick über die wichtigsten nanoanalytischen Methoden und gibt Ihnen einen ersten Eindruck.

Wie bewerten Sie als Experte das Alterungsverhalten von Beschichtungen? Haben Optimierungen und Maßnahmen funktioniert?

Das Seminar stellt Ihnen analytische Nachweisverfahren für die Erforschung von Nanoschichten oder z.B. zur Qualitätskontrolle vor.

Für die Detektion organischer Substanzen auf Oberflächen mit höchster Empfindlichkeit ist TOF-SIMS die etablierte Analysenmethode.

Freuen Sie sich auf die Vorstellung der neuesten Geräteentwicklungen, in der Oberflächenanalytik!

Unser Seminar, genau das Richtige für Sie

## Kontaktinformationen:

Anmeldung zum kostenlosen Seminar inklusive Testmessungs-Gutschein für Neukunden, Verpflegung während des Seminars sowie Unterlagen zum Themengebiet.

Ihre Anmeldung richten Sie bitte per E-Mail, auf dem Postweg bzw. per Telefon oder Fax an:

Physical Electronics GmbH  
z. Hd. Stefanie Zauzig  
Fraunhoferstraße 4  
D-85737 Ismaning  
TEL. +49/89/96 275-0  
FAX +49/89/96 275-50  
Email [szauzig@phi-europe.com](mailto:szauzig@phi-europe.com)  
URL [www.phi-gmbh.eu](http://www.phi-gmbh.eu)

Auch bei sonstigen Fragen zum Seminar steht Ihnen Frau Zauzig gerne zur Verfügung.

Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen begrenzt, darum bitten wir Sie, sich rechtzeitig anzumelden.

Sie können leider nicht teilnehmen?  
Gerne senden wir Ihnen Informationsmaterial über alternative Termine zu.

